

QuickView Signoff Data Analysis Environment 操作性に優れた高速なスタンドアロンチップフィニッシングシステム

Cadence® QuickViewは、操作性に優れた高速のスタンドアロンチップフィニッシングシステムで、複数のデータフォーマットのデザインデータやマニファクチャリングデータをサポートしています。QuickViewは、大規模なレイアウトデータ（GDSII, OASIS, LEF/DEF及び、マニファクチャリングデータ）を非常に高速に読み込み、豊富なデバッグ機能、例えば、ネットトレース、多彩な表示制御、データの重ね合わせ、GDSIIやOASISの編集機能などを提供します。

概要

QuickView の大規模データ対応により、ユーザは巨大なレイアウトデータを瞬時に読み込むことが可能で、そのサインオフ解析環境を使って、複数のレイアウトデータを同じウインドウ上に表示した上で、様々なチップフィニッシング作業を行うことができます。

QuickView は、Cadence Physical Verification System (PVS)と密接に統合されており、PVS が Cadence Innovus™ Implementation System 及び、Cadence Virtuoso®プラットフォーム上で動作すると同様の解析環境やフローを提供します。また、他社の解析ツールとも動作します。

非常に高速で拡張性の高い QuickView により、設計チームやマニファクチャリングチームは、効率的にテーパーアウト及びチップフィニッシング作業を行うことができます。

利点

- 複数種類のデータ表示機能によって、チップフィニッシング工程において様々なデータを表示し重ね合わせて解析をすることが可能
- 非常に高速で、大規模データに対応した多くのオプション機能により、1µm より小さいような図形からレチクルやウェハ規模のデータを表示可能
- 非常に優れた重ね合わせ機能や視覚的 XOR 機能により、GUI 上でのデータの比較が容易になります

- 実際のマニファクチャリングデータに基づいたグラフィカルなレチクルデータの検証により、膨大なジョブデックエラーを取り除き、サイクルタイムの予測性を改善
- スケーリング、オフセット設定、回転、ミラーリングにより、複数データの重ね合わせや比較が可能
- 高速でパワフルな計測及び、解析機能
- DRC エラー表示及び、効率的な解析機能
- 一般的な画像フォーマットとデザインデータ及びマニファクチャリングデータとの重ね合わせ機能
- 業界標準データフォーマットをサポート
- ユーザーカスタマイズを可能とする専用マクロ言語をサポートし、独自の表示や解析機能の作成が可能

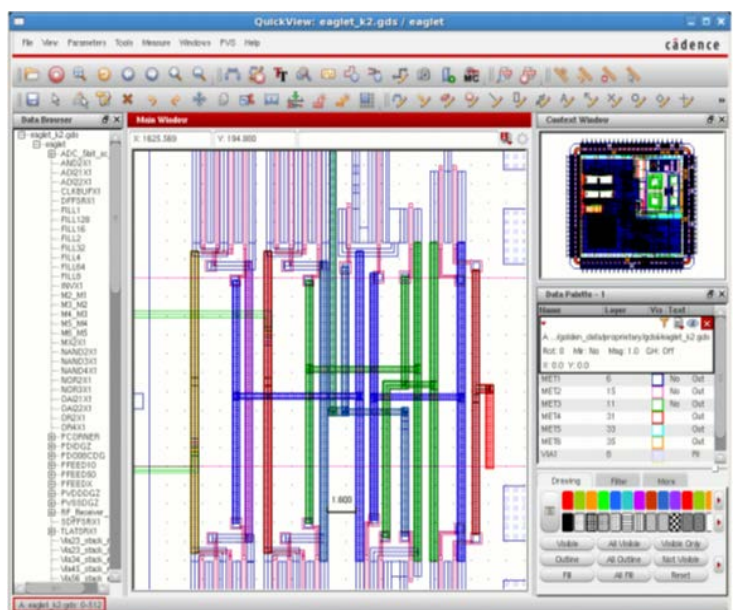


図 1 : QuickView Signoff Data Analysis Environment

特長**複数レイアウトフォーマット**

- サポートフォーマット
 - GDSII
 - OASIS
 - LEF/DEF
 - OpenAccess
 - LAFF
 - GL/1
- セル名の重複を意識することなく、複数のデータベース間の変更箇所やアライメント、相互関係を確認することが可能
- ミラーリング、回転、スケーリング、オフセット設定での表示及び解析
- セルデータ、図形データ、テキストデータに対する高機能な検索
- ノーマルトーン表示及びリバーストーン表示(白黒反転表示)のサポート
- 表示データからの高速な情報取得

PVS インテグレーション

- PVS との統合による DRC, XOR, LVS, ERC 解析ジョブの投入及び、デバッグ環境
- 大規模データにおいても、エラー表示における LVS/ERC エラーデータとのクロスプロービングが可能
- Virtuoso の Technology ファイルを読み込み利用が可能

複数マニファクチャリングデータフォーマット及びジョブデック

- サポート先端マニファクチャリングデータフォーマット
 - MEBES フォーマット Model 5 まで (データ及び、ジョブデック)
 - JEOL 1.0, 1.1, 2.1, 3.0, 3.1 (データ及び、ジョブデック)
 - Toshiba VSB 11, 12 (データ及び、ジョブデック)
 - HL800, HL900, HL950 (データ)

- パターンデータ表示において、図形を縞模様で表現したり境界線を分割して表示したり、仮想的に重ね合わせて表示をすることが可能
- ミラーリング、回転、スケーリング、オフセット設定での表示及び解析
- セルデータ、図形データ、テキストデータに対する高機能な検索
- ジョブデックファイルを介してフラクチャリンデータを読み込み、マスクもしくはレチクルデータを高速に表示することが可能

強力なサインオフ解析環境

- レイヤー間の接続関係を定義することにより、接続された図形の検索やハイライトによる解析が可能
- 検索された接続図形における、2 点間パスの解析
- 複数のデータベースのマージ機能
- データベースのフォーマット変換
- GDSII データベース間でのセルのリプレース機能
- GDSII データでの図形情報編集及び、保存機能

ケイデンスのサービスとサポート

- ケイデンスのアプリケーションエンジニアは、電話、E-mail、インターネットで技術的な質問にお答えします。テクニカルサポートやトレーニングもご提供します。
- ケイデンスが認定したインストラクターが、70 以上のコースを開講しており、実際の現場での経験を教室でお伝えします。
- インターネット活用トレーニング (iLS) オンラインコースは 25 以上あり、インターネットを利用して柔軟にトレーニングを受講いただけます
- Cadence Online Support では、最新のソリューション、テクニカルドキュメント、ソフトウェアのダウンロードに 24 時間 365 日、アクセスいただけます

**日本ケイデンス・デザイン・システムズ社**

本社 / 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-100-45
 営業本部 TEL.(045)475-8410 FAX.(045)475-8415
 URL <http://www.cadence.co.jp/>



販売代理店 **イノテック株式会社** IC ソリューション本部

〒222-8580 神奈川県横浜市港北区新横浜 3-17-6
 TEL.(045)474-2290,2291,2293 (営) FAX.(045)474-2395
 URL <http://www.innotech.co.jp/>